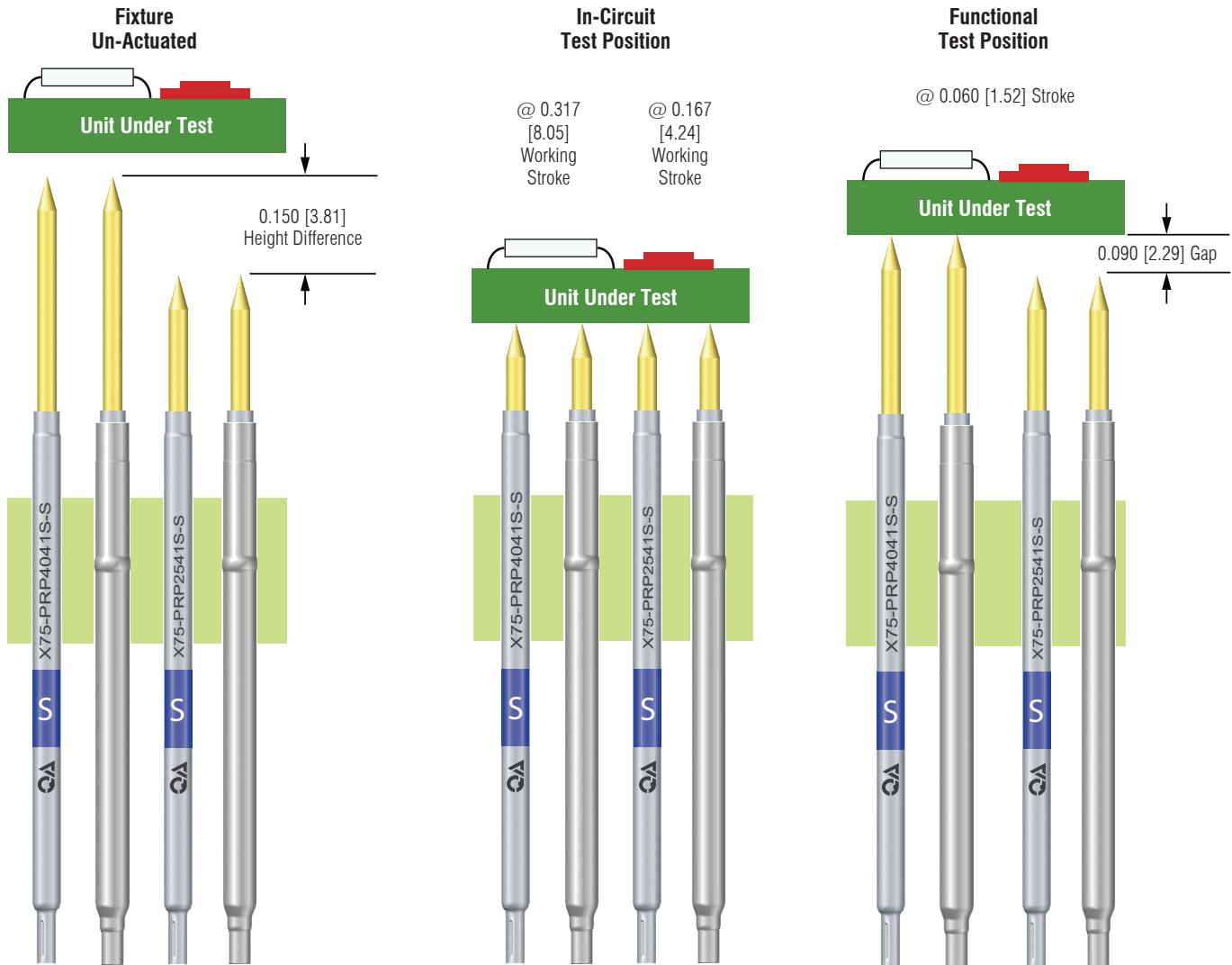




Sondas de Carrera Larga para Pruebas de Nivel Dual

Para hacer una prueba funcional de componentes (FCT) y de In-Circuit (ICT) en la misma fixtura, use una sonda de carrera larga para la parte funcional de la prueba. Sondas de carrera larga de 0.400 [10.16] de QA Technology están diseñadas para esta función. Para pruebas de nivel dual, estas se mezclan fácilmente con las sondas de carrera estándar de 0.250 [6.35], disponibles en una variedad de tamaños. Esto permite la misma altura al montar las bases o pines de terminación para la misma serie. Sondas de carrera larga son 0.150[3.81] mas largas que las sondas aledañas de carrera estándar cuando la fixtura esta en la posición desactivada. Durante la prueba de ICT, las sondas de carera larga se retractan a 0.317 [8.05], y las sondas de carrera estándar tendrán una cerrera de 0.167 [4.24], la cual es la posición de trabajo recomendada. En la posición de prueba funcional, las sondas de carrera larga se comprimen aproximadamente 0.060[1.52], dejando un espacio de 0.090 [2.29] con las sondas estándar.



*Nota: Al instalar los casquillos 050-25 o las clavijas de terminación X39-25 para la prueba de nivel dual, las terminaciones de los casquillos de carrera de 0.250 [6.35] deben montarse 0.015 [0.38] más arriba para lograr la diferencia de altura de punta de 0,150 cuando el dispositivo no está accionado.